

# プレス発表資料



平成18年 4月28日  
独立行政法人大学入試センター

平成18年度大学入試センター試験英語リスニングテストにおける  
不具合等の申し出があった機器の検証結果等について

## 解答中に不具合等の申し出があったもの

1 検証対象機器台数 444台

(参考) 解答中に不具合等の申し出があった機器台数 471台

(注) 上記471台のうち、机上からの落下や急な体調不良等による申し出があった27台は対象から除いた。

## 2 検証方法

不具合機器について、大学入試センター職員立会いのもと、メーカーが検証作業を実施。全体の約4割について大学入試センターも抜取り検査を実施。

## 3 検証結果

(単位：台)

不具合の態様	機器の不具合の原因		台数
音声が出ない 又は中断	A . 機器の製造工程に起因するもの	イヤホン不良	2
		スイッチ不良	1
		IC不良	2
	小 計		5
	B . 機器の使用時の事情に起因するもの	音声メモリーにゴミが付着	58
再生ボタン長押し失敗		111	
小 計		169	
雑音が入る又は音声が不安定	C . イヤホンの素材に起因するもの	イヤホン差込部の酸化被膜発生による接触不良	258
	D . その他	検証では不具合が再現できず、かつ、不具合の原因の形跡が確認できなかったもの	12
	合 計		444

解答開始前の作動確認中に不具合等の申し出があり、機器を交換したものの

検証対象機器台数 1,023台

(単位：台)

不具合の態様	機器の不具合等の原因		台数
音声が出ない 又は中断	A . 機器の製造工 程に起因する もの	イヤホン不良	16
		IC不良	6
		基板への部品取付け不良	1
		絶縁シートが抜けない	28
	小 計		51
	B . 機器の使 用時の事情に 起因するもの	音声メモリーにゴミが付着	599
雑音が入る又 は音声が不安 定	C . イヤホン の素材に起因 するもの	イヤホン差込部の酸化被膜発生による接触不良	322
	D . その他	検証では不具合が再現できず、かつ、不具合の 原因の形跡が確認できなかったもの	51
	合 計		1,023

## 考えられる改善策案

検証結果を踏まえ、現在のところ以下のような改善策案が考えられるが、今後、関係者の意見を聞きつつ、さらに検討を進めていくこととする。

機器の不具合等の原因		機器の改善策案	試験の進行・受験生への指示の改善策案
A . 機器の製造工程に起因するもの	イヤホン不良 スイッチ不良 IC不良 基板への部品取付け不良	検査精度を高める。(不良品の排除を徹底) (製造工程における改善方策についても検討に最善を尽くす)	
	絶縁シートが抜けない	電池端子ばねの終端の向きを変更	
B . 機器の使用時の事情に起因するもの	音声メモリーにゴミが付着	音声メモリーをひとつずつ袋に入れる。 プレーヤー内のコネクタ端子部の形状を改善しゴミをはさみづらくする。	
	再生ボタン長押し の失敗	電源ボタン, 確認ボタンについても長押しにする。	操作ボタンがすべて長押しであることを事前に十分周知する。 ICプレーヤー本体, 試験問題冊子等に操作ボタンはすべて長押しである旨を印刷する。 試験開始等の指示の際に, 「ランプが点くまで」又は「音声が届くまで」長く押すように強調する。
C . イヤホンの素材に起因するもの	イヤホン差込部の酸化被膜発生による接触不良	イヤホンジャック・プラグを銀メッキ・ニッケルメッキから酸化しにくい素材によるメッキとする。	

## 機器の有効活用の検討

機器については、今後とも受験生が持ち帰ることができることとするが、機器の有効活用を図る観点から、以下のように取扱う方針で検討している。

受験生に、試験結果のチェック等に十分活用した後は、高等学校に提供するように促す。高等学校側にも機器の有効活用について周知し、各校での指導に活用されるようにする。

持ち帰らなかった機器は、大学入試センターから希望する高等学校に提供し、各校での指導に活用する。

その後に大学入試センターに残った機器は、製造業者において可能な限りリサイクル活用を図る。

(参考) 不具合機器の検証手順

検証工程	ねらい	主な確認事項
1 外観確認 ↓	外的損傷等の確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プレーヤー等全体外観</li> <li>・音声メモリー，イヤホンの挿入具合</li> <li>・ビスの脱落</li> <li>・イヤホンの形状異常</li> </ul>
2 リスニング 検査 ↓	申し出のあった症状の有無の確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器動作の異常</li> <li>・音声の異常</li> </ul>
3 ショック テスト ↓	リスニング検査で，申し出のあった症状が現れなかったものについて，外的な振動等を与えて症状を確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>・音声再生時に振動，イヤホンジャックの回転を加えて症状を確認</li> </ul>
4 負荷テスト ↓	意図的に異なる環境を与えて音声の状況を確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用初期と同様の状態で，恒温室 0 に 8 時間安置後，再生</li> <li>・その後，同要領で 40 を実施</li> </ul>
5 X線検査 ↓	肉眼では分からない I C の不良箇所を確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>・X線装置で全方向からワイヤボンディングの状況を観察</li> </ul>
6 内部確認	機器を分解し，指摘症状から想定される関係部品を顕微鏡等により確認	<ul style="list-style-type: none"> <li>・音声メモリーと本体の通信波形の確認</li> <li>・半田付け状態やプリント配線の状況</li> <li>・各関係部品の状況</li> </ul>

1～4の検証作業にセンター職員も立ち会うとともに，3の検証作業後に抜取り検査を実施。

この件に関する問い合わせ先  
 独立行政法人大学入試センター  
 管理部総務課企画広報係  
 TEL 03-5478-1316(直通)